



電子顯微鏡技術分析 研習會



時間：2026/05/29 (星期五)

報名QR code



地點：國立陽明交通大學
材料科學與工程學系工程六館
國際會議廳(一樓)

報名截止2026/05/20

時段	議程	主講人
08:00 - 09:00	報到及交流	
09:00 - 09:10	開幕致詞	基礎研究核心設施學門召集人 張六文教授 國立陽明交通大學材料系 吳文偉 教授
09:10 - 09:20	貴賓致詞	台灣顯微鏡學會理事長 羅聖全博士 陽明交大儀資中心主任 趙天生教授
09:20 - 09:30	團體合影	全體與會人員
09:30 - 10:00	茶點時間	
10:00 - 10:50	電子顯微鏡學理介紹 (一)	國立陽明交通大學材料系 張立 教授
11:00 - 11:50	電子顯微鏡學理介紹 (二)	國立陽明交通大學材料系 張立 教授
11:50 - 13:20	午餐時間	
13:20 - 14:10	TEM/EDS訊號 真偽判斷與修正	宜特科技 鮑忠興 博士
14:20 - 15:10	利用掃描穿透式電子顯微鏡 (STEM) 與 4D-STEM 解析 材料的顯微結構演化	國家實驗研究院國家儀器科技研究中心 & 國立陽明交通大學材料系 鍾采甫 教授
15:10 - 15:40	茶點時間	
15:40 - 16:10	FIB-SEM先進分析技術分享	台灣蔡司 林坤興 資深產品經理
16:10 - 16:40	EBSD4.0: 高速高靈敏直接電 子探測技術簡介	台灣布魯克 焦匯勝 博士
16:40 - 17:10	技術交流與討論	全體與會人員與全體講師
17:10	賦歸	



補助單位：國家科學及技術委員會
主辦單位：台灣顯微鏡學會、國立陽明交通大學
儀器資源中心、材料科學與工程學系